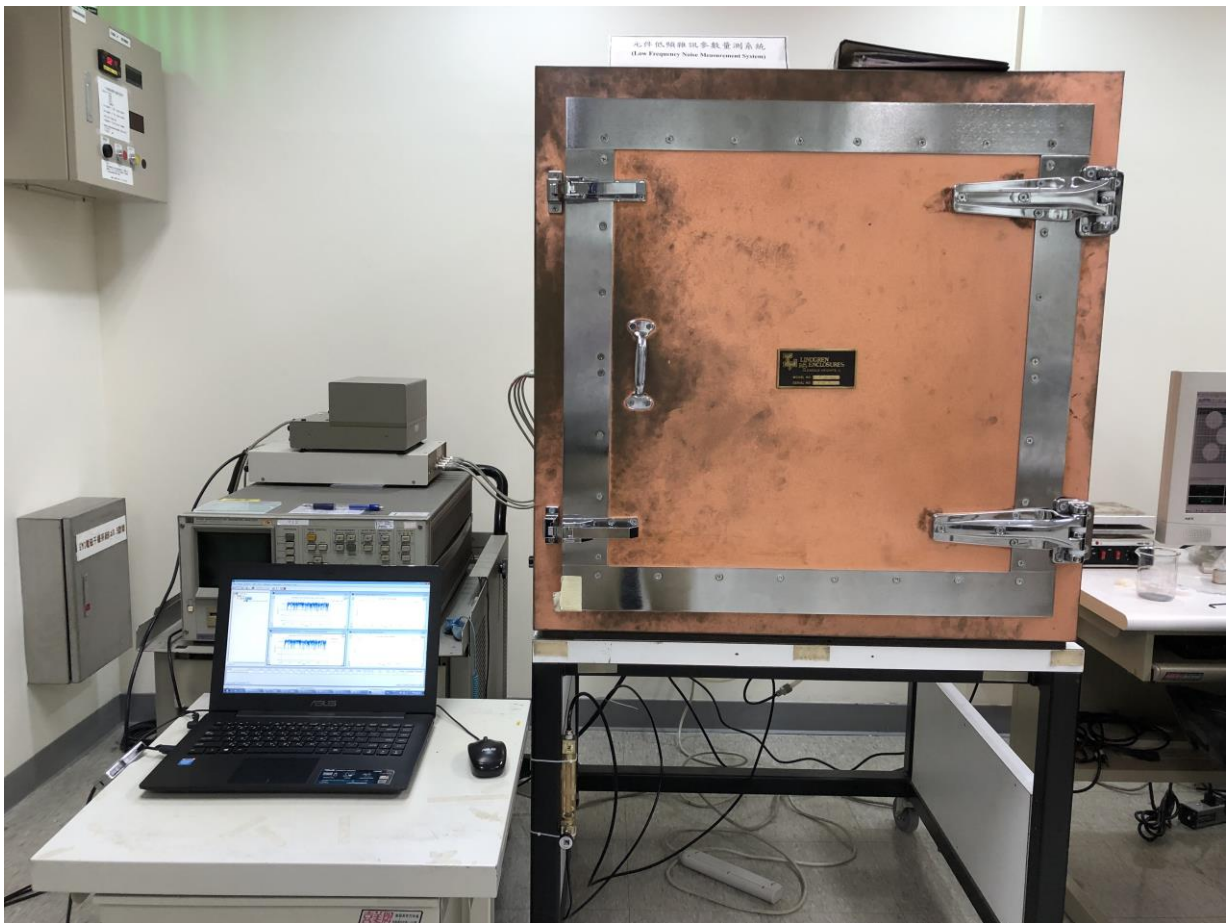


元件低頻雜訊參數量測系統

Low Frequency Noise Measurement System

機台編號	儀器名稱	儀器負責人	分機	使用聯絡人	分機	開放等級	位置
HF-007	元件低頻雜訊參數量測系統	陳柏源	7570, 7607	林壯儒	7638, 7607	B-2	R405

『元件低頻雜訊參數量測系統』提供半導體元件之低頻雜訊頻譜量測，以及隨機電報雜訊(RTS Noise)的時域特性分析，搭配 ProPlus 的 NoisePro Plus 軟體，可進一步萃取元件的低頻雜訊模型參數。藉由低頻雜訊量測，除了可以建立低頻雜訊模型外，及量測資料亦可以分析半導體元件的材料品質與缺陷分佈。



系統規格及型號：

Hardware:

1. Noise analyzer (9812B)
2. Dynamic signal analyzer (Agilent 35670A)
3. IV meter (Agilent 4145B)

- Frequency range : 1 Hz ~ 100 kHz

- DC Voltage and Current Characteristics :

Voltage Range	Current Range
-20 V ~ +20 V	-100 mA ~ +100 mA

Software :

1. ProPlus NoisePro Plus

2022/01/03